



ProView™ XD 光纤端面质量检测干涉仪显微镜 (用于光纤支架 光纤包层直径 220-1200μm)



总览

ProView XD 是一款高度先进的干涉仪，用于精确测量和检查直径为 220 至 1200μm 的光纤端面。干涉仪是专门为生产线设计的，在生产线上需要简单、快速和非常准确的端面检测。但 ProView XD 也非常适合研发环境和光纤切割机维护目的。在许多情况下，干涉条纹图案可以非常复杂地进行分析和理解。为了便于使用和优化检查速度，ProView XD 包括高度先进的全自动功能，用于端面表面的 2D 和 3D 地形分析。该软件自动指示端面的角度、平面度和坡度方向。为了进一步简化检查过程，ProView XD 可以设置为“通过/未通过”模式。此功能允许操作员通过图像上的颜色代码简单地确定端面质量。除了劈裂角检查外，ProView XD 还可用于测量其他一些特性，如光纤直径和定义点之间的距离等。ProView XD-用于光纤支架的产品配有通用 V 形槽夹具组件，该组件可容纳 FTEL 或藤仓的标准光纤支架，但也允许使用裸光纤。还有可选的支架可用于检查标准 SMA、FC/PC、ST/PC 或 LD80 连接器。可根据要求提供定制夹具或适配器。ProView XD 设计紧凑，是生产台的理想选择，可与熔接机、切割机和准备工具并排使用。ProView XD 通过 USB 3.0 电缆连接并通电，由外部 PC（不包括在内）托管。

产品特点

- 适用于 220 至 1200 μm 的光纤包层直径
- 2D 和 3D 地形
- PC 控制器 GUI 的条纹和检查模式
- 通过自动角度估计，检测速度非常快
- 可选择使用通过/失败切割角度指示
- 检查端面特性，如平面度、垂直度、锯齿和污染
- 抓取并保存 2D 和 3D 图像以及切割数据



通用参数

技术参数

尺寸:	86(宽) x 127(长) x 93(高) mm 86(宽) x 140(长) x 97(高) mm (包括, 对焦旋钮和橡胶脚)
重量:	1.2 kg
电源供应:	通过 USB 端口
PC 接口:	超高速 USB (USB 3.0) Type-A, 2 米数据线
环境:	工作温度:10℃~ 40℃ 存储温度:-20℃~ 50℃ 湿度:5% ~ 95% RH(无冷凝)
光纤直径:	220 μm - 1200 μm
视野:	~ 1300 μm
分辨率:	2560 x 1920 (4.92 MP)
传感器:	互补金属氧化物半导体(单色)
图像文件格式:	JPEG, PNG, TIFF, GIF

系统采集范围和精度

高度, 峰谷波值:	15 μm
角度, 220 μm 光纤:	高达 3.9°
角度, 400 μm 光纤:	高达 2.1°
角度, 720 μm 光纤:	高达 1.2°
角度, 1200 μm 光纤:	高达 0.7°



绝对精度: (1)	0.03° 标准偏差(<400 μm, ROI = 90%) 0.02° 标准偏差(>400 μm, ROI = 90%)
相对精度: (1)	5% 高达 2°

(1) 采用软件标定补偿。

系统要求

电脑:	装有英特尔 i5(或更高版本)的个人电脑
USB: (2)	一个免费的 USB 3.0 接口(超高速)
内存:	4GB 内存(推荐 16GB 内存)
磁盘空间:	100 MB (500 MB recommended)
操作系统:	Windows 8/8.1/10 64 位(使用 .net Framework 4.8 或更高版本)
显卡:	支持 3D 图形(推荐专用 GPU)
显示分辨率:	1920 x 1080 (推荐双监控系统)
输入设备:	键盘和三键滚轮鼠标(或同等设备)

(2) 仅使用直接连接到 PC 主板的 USB 3.0 端口 (即不带内部延长线的端口)。

型号及包装

产品	型号 #	数量
NorthLab ProView™ XD - 用于光纤支架	IF-12-01000	
标准包装		
FITEL (S712) F/H 平台	IF-90-01001	1
FITEL (S713) 和 Fujikura F/H 平台	IF-90-01002	1



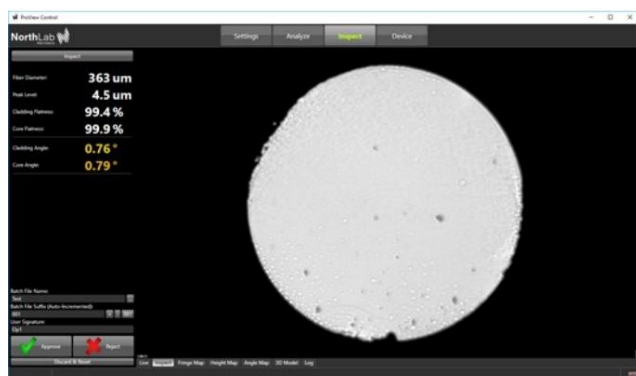
垫片 (100、400、600、800、1000 μ m)	IF-90-01003	1
USB 3.0 电缆	N/A	1
用户手册和 PC 软件	N/A	1
配件和备件		
通用 V 型槽夹具	IF-90-01004	
SMA 连接器支架	IF-90-01010	
FC/PC 连接器支架	IF-90-01011	
ST/PC 连接器支架	IF-90-01012	
LD80 连接器支架	IF-90-01013	

FITEL/FUJIKURA 纤维支架平台

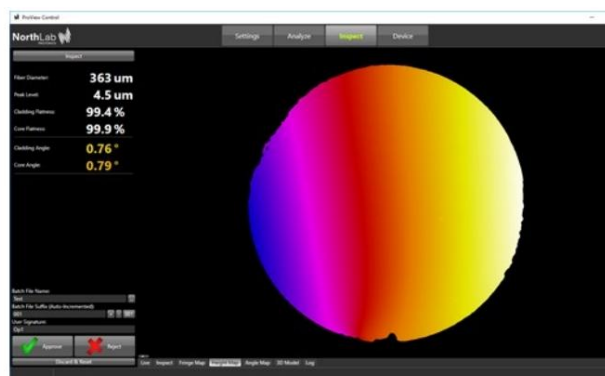




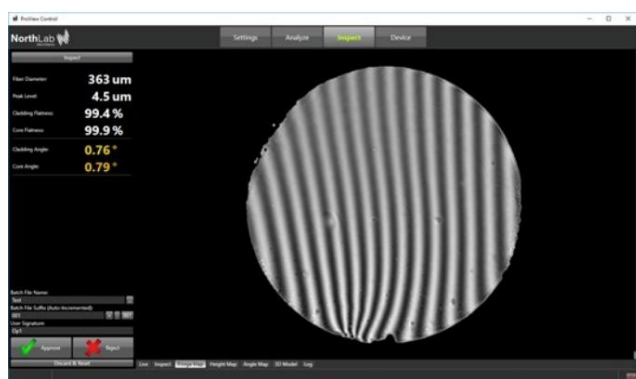
显微镜视图 ,高度图视图 ,干涉仪视图 以及三维模型视图



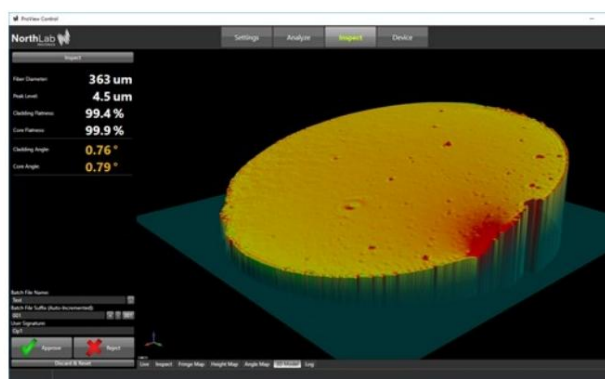
MICROSCOPE VIEW



HEIGHT MAP VIEW



INTERFEROMETER VIEW



3D MODEL VIEW